

國立中山大學貴重暨共用儀器中心儀器計費一覽表

學術服務領域	儀器名稱	項目名稱	英文名稱	單位	計畫預約單價	非計畫預約單價	自行操作計畫費單價	自行操作非計畫費單價
年度					115	115	115	115
化學								
1	電子順磁共振光譜儀	DMPO試劑	DMPO	0.001g 單位	200	400	0	0
		TEMP 試劑	TEMP	0.05 g 單位	100	200	100	200
		TEMPO試劑	TEMPO	0.05g單位	100	200	100	200
		水氧敏感樣品前處理	sample preparation for O ₂ -/moisture-sensitive compound	單一樣品	300	2,000	0	0
		汞燈照射	irradiation with UV lamp	單一樣品15分鐘內每單一波長	300	1,200	300	1,200
		汞燈裝置架設	installation fee for UV lamp equipments	單一預約序號	600	0	600	0
		非水氧敏感樣品前處理	sample preparation for O ₂ -/moisture-stable compound	單一樣品	150	1,000	0	0
		室溫基本量測	measurement at room temperature	單一樣品	200	1,000	0	0
		液氮變溫測量架設	installation fee for liquid-helium equipments	單一預約序號	1,200	0	1,200	0
		液氮變溫量測	variable-temperature measurement (4K - 340 K)	單一樣品當一溫度/120分鐘	800	6,000	800	6,000
		液氮定溫量測	mearement at constant temperature	150分鐘	400	4,000	400	4,000
		液氮變溫量測	variable-temperature measurement (77K - 340 K)	單一樣品每單一溫度/30分鐘	400	2,000	400	2,000
		液氮變溫裝置架設	Installation of liquid nitrogen variable temperature measuring device	1 次	1,000	0	1,000	0
2	基質輔助雷射脫附游離飛行時間質譜儀	ESI低解析一次質譜定性分析	ESI/QQQ/MS	件	300	1,500	0	0
		ESI低解析二次質譜分析 (含一次質譜定性分析)	ESI/Q-TOF/MS/MS	訊號峰	350	1,800	0	0
		GC/MS 一次質譜定性分析	GC/MS	件	500	1,000	0	0
		GC/MS 資料庫搜尋	GC/MS database searching	訊號峰	50	100	0	0
		HPLC/ESI/QQQ 一次質譜定性分析	HPLC/ESI/QQQ/MS	件	1,200	3,000	0	0
		HPLC/ESI/QQQ 二次質譜分析 (含一次質譜定性分析)	HPLC/ESI/QQQ/MS/MS	訊號峰	50	100	0	0
		LCMS定量分析	HPLC/ESI/QQQ/MS/MS Quantification	件	8,000	10,000	0	0
		LCMS層析條件優化	chromatographic conditions	件	3,000	6,000	0	0
		MALDI 二次質譜分析 (含一次質譜定性分析)	MALDI-TOF/MS/MS	件	350	1,800	0	0
		MALDI 影像質譜	MALDI Imaging	件	10,000	50,000	0	0
		MALDI一次質譜定性分析	MALDI-TOF/MS	件	300	1,500	0	0
		TD-ESI 一次質譜定性分析	TD-ESI/MS	件	300	600	0	0
		TD-ESI 二次質譜定性分析 (含一次質譜定性分析)	TD-ESI/MS/MS	訊號峰	1,800	1,800	1,800	1,800
		資料檢索	Database search	次	20	20	0	0
3	超高效能傅立葉轉換電場軌道質譜儀	ESI低解析	ESI	件數	200	1,500	0	0
		高解析度 ESI	high resolution mass(ESI)	件數	300	2,000	0	0
		高解析度MS/MS ESI	MS/ MS ESI high resolution mass(ESI)	件數	300	2,000	0	0
		資料分析	data processing	件數	150	500	0	0
4	600MHz 核磁共振儀 (JEOL ECZ-600R)	1D夜間實驗	1Dovernight EXP	12小時	600	6,000	600	6,000
		2D夜間實驗	2D overnight EXP	15小時	900	6,000	900	6,000
		每樣品前半小時	the first 0.5hr /per sample	半小時	150	700	150	700
		假日長時實驗	Long time EXP on holiday	48小時	2,000	2,000	2,000	2,000
		超過半小時者 · 每半小時	after 0.5hr,per 0.5hr	半小時	90	500	90	500
		變溫實驗	VT experiment	改變溫度每單位	200	200	0	0
材料								
1	FEI Tecnai F20 G2 場發射掃描穿透式電子顯微鏡	EDS 分析 (點 · 線 · 面分析)	EDS Analysis (Point · Line scan · Mapping)	小時	100	300	50	0
		NBD/CBD 繞射分析	NBD/CBD Analysis	小時	100	300	50	0
		STEM 分析 (HAADF)	STEM Analysis (HAADF)	小時	100	300	50	0
		高解析成像分析	HR Analysis	小時	100	300	50	0
		電子能量損失能譜EELS/GIF分析	EELS/GIF Analysis	小時	200	600	100	0
		儀器使用費 · 每時段3小時/1小時 計費一次	user charge (3 hours per session)	小時	600	2,000	300	0

國立中山大學貴重暨共用儀器中心儀器計費一覽表

學術服務領域	儀器名稱	項目名稱	英文名稱	單位	計畫預約單價	非計畫預約單價	自行操作計畫費單價	自行操作非計畫費單價
年度					115	115	115	115
2	場發射型掃描式電子顯微鏡	能量分散分析儀面分析	Energy Dispersive Spectrometer-Mapping	次	100	200	100	200
		能量分散分析儀線分析	Energy Dispersive Spectrometer-Line scan	次	100	200	100	200
		能量分散分析儀點分析	Energy Dispersive Spectrometer- Point	點	50	100	50	100
		陰極螢光測試儀常溫	Cryogenic Cathodoluminescence system-normal temperature	小時	150	250	150	250
		場放射型掃瞄式電子顯微鏡	JEOL 6330 TF Field Emission Electron Microscope	小時	300	1,500	200	1,500
		數位影像處理與傳輸	Digital Image Processing	張	10	10	10	10
3	軟物質分析穿透式電子顯微鏡	形態觀察分析及繞射分析	Morphology and Diffraction Analysis	時段	1,800	6,000	600	0
		能量分散光譜儀(EDS)點分析	EDS	點	100	300	100	300
4	Talos F200X G2 高解析場發射掃描穿透式電子顯微鏡	EDS(點/線/面)分析	EDS (point/line/map) analysis	小時	200	600	100	0
		STEM(BF/DF/HAADF)分析與HRSTEM分析	STEM(BF/DF/HAADF) and HRSTEM	小時	300	900	150	0
		TEM基本時段(影像與繞射圖)	TEM basis period	小時	600	2,500	300	0
		示差像對比(DPC)影像分析	Differential phase contrast (DPC) analysis	小時	300	900	150	0
		高解析成像分析	HRTEM	小時	150	450	70	0
		高解析原子影像EDS(點/線/面)分析	Atomic-resolution EDS (point/line/map) analysis	小時	500	1,500	250	0
		微區繞射與聚束電子繞射	NBD/CBED	小時	100	300	50	0
5	多功能高解析場發射型掃描式電子顯微鏡	多功能高解析掃瞄式電子顯微鏡	Zeiss G450 Field Emission Electron Microscope	小時	400	2,500	250	2,500
		能量分散分析儀面分析	Energy Dispersive Spectrometer-Mapping	次	100	200	100	200
		能量分散分析儀線分析	Energy Dispersive Spectrometer-Line scan	次	100	200	100	200
		能量分散分析儀點分析	Energy Dispersive Spectrometer- Point	點	50	100	50	100
		數位影像處理與傳輸	Digital Image Processing	張	10	50	10	50
6	高解析電子顯微鏡	定量分析	Quantitative analysis	點	20	100	10	50
		線分析、面分析、定性分析	mapping and line scan	次	80	300	40	150
		燈絲使用時間	basic expense	小時	600	1,200	450	900
7	歐傑電子能譜儀	AUGER元素影像掃描	AUGER MAPPING	小時	350	3,000	350	3,000
		AUGER單元素能譜圖	AUGER NARROW SCAN	小時	350	3,000	350	3,000
		AUGER縱深分布圖	AUGER DEPTH	小時	350	3,000	350	3,000
		XPS化學態/成分分析	XPS WILD SCAN AND NARROW SCAN	小時	350	3,000	350	3,000
		XPS縱深分布圖	XPS DEPTH	小時	350	3,000	350	3,000
8	多功能 X 光 繞射儀	X光反射率	XRR	每件30分鐘,超時累計	150	1,000	150	1,000
		X光低掠角繞射	Grazing Incident Diffraction X-ray	每件30分鐘,超時累計	150	1,000	150	1,000
		相鑑定	data search	每件	150	1,000	150	1,000
		相鑑定	data search	每件	150	1,000	150	1,000
		高解析磊晶繞射分析	High Resolution X-ray	每件30分鐘,超時累計	150	1,000	150	1,000
		超時計費	Overtime billing	每30分鐘	150	1,000	150	1,000
		極圖量測分析	pole figure	每件30分鐘,超時累計	150	1,000	150	1,000
9	粉末繞射儀	一般繞射分析	powder diffraction	每件30分鐘,超過則累計	130	800	130	800
		一般繞射分析	powder diffraction	每件30分鐘,超過則累計	130	800	0	0
		相鑑定	件	每件	130	800	130	800
		相鑑定	powder diffraction	每件 600元	600	600	600	600
		超時計費	Overtime billing	30分鐘	130	800	130	800
奈米製程								
1	高密度電漿化學氣相沉積系統	重新訓練費	Retraining fee	1次	850	850	0	0
		重新認證費	Recertification fee	1次	350	350	0	0
		訓練費	Training fee	1次	1,700	1,700	0	0
		認證費	Certification fee	1次	700	700	0	0

國立中山大學貴重暨共用儀器中心儀器計費一覽表

學術服務領域	儀器名稱	項目名稱	英文名稱	單位	計畫預約單價	非計畫預約單價	自行操作計畫費單價	自行操作非計畫費單價
年度					115	115	115	115
2	感應耦合式電漿蝕刻系統	儀器使用費	measurement	0.25小時	650	750	350	650
		重新訓練費	Retraining fee	1次	850	850	0	0
		重新認證費	Recertification fee	1次	350	350	0	0
		訓練費	Training fee	1次	1,700	1,700	0	0
		認證費	Certification fee	1次	700	700	0	0
3	多靶磁控濺鍍系統	儀器使用費	measurement	0.25小時	650	750	350	650
		重新訓練費	Retraining fee	1次	550	550	0	0
		重新認證費	Recertification fee	1次	300	300	0	0
		訓練費	Training fee	1次	1,100	1,100	0	0
		認證費	Certification fee	1次	600	600	0	0
4	雙電子槍蒸鍍機	儀器使用費	measurement	0.25小時	420	500	250	450
		Mo坩鍋	Mo crucible	1個	2,500	2,500	2,500	2,500
		重新訓練費	Retraining fee	1次	550	550	0	0
		重新認證費	Recertification fee	1次	300	300	0	0
		訓練費	Training fee	1次	1,100	1,100	0	0
		認證費	Certification fee	1次	600	600	0	0
5	光學微影系統	儀器使用費	measurement	0.25小時	420	500	250	450
		Si wafer	Si wafer	1片	600	600	600	600
		重新訓練費	Retraining fee	1次	300	300	0	0
		重新認證費	Recertification fee	1次	300	300	0	0
		訓練費	Training fee	1次	600	600	0	0
		認證費	Certification fee	1次	600	600	0	0
6	薄膜特性分析儀	儀器使用費	measurement	0.25小時	350	550	150	350
		Si wafer	Si wafer	1片	600	600	600	600
		光碟片	CD	1片	10	10	10	10
		重新訓練費	Retraining fee	1次	300	300	0	0
		重新認證費	Recertification fee	1次	300	300	0	0
		訓練費	Training fee	1次	600	600	0	0
		認證費	Certification fee	1次	600	600	0	0
物理	多功能原子力顯微鏡	儀器使用費	measurement	0.25小時	300	450	200	400
		委託量測	Commissioned Measurement	小時	900	3,500	500	5,000
2	高階三束型聚焦離子束顯微鏡	高階三束型聚焦離子束顯微鏡	FIB	1小時	3,000	8,000	3,000	8,000
		高階三束型聚焦離子束顯微鏡 (0.25hr)	FIB(0.25hr)	0.25小時	750	2,000	750	2,000
		高階三束型聚焦離子束顯微鏡(廠商)	FIB(Vendor)	1小時	0	8,000	8,000	8,000
		高階三束型聚焦離子束顯微鏡(廠商0.25hr)	FIB(vendor 0.25hr)	0.25小時	0	2,000	2,000	2,000
		鍍白金	Pt coating	1次	300	300	300	300
		鍍碳銅網試片盒	grid box	1盒	200	200	0	0
		鍍碳銅網	copper grid	1片	60	60	60	60
3	常壓雙光源光電子能譜儀	UPS分析	UPS	小時	400	4,000	0	0
		Ar離子槍(表面清潔)	Ar ion bombardment	小時	100	1,000	0	0
		X射線光電子能譜分析	monochromated xps	小時	350	3,500	0	0
		加開電子槍	Charge neutralization	小時	50	500	0	0
4	超導量子干涉磁量儀	儀器使用時間	Measurement time in SQUID	小時	400	1,000	400	1,000